

## ДИФРАКЦИЯ СВЕТОВЫХ ВОЛН

**Дифракция** - огибание волнами препятствий и проникновение волн в область геометрической тени (т.е. отклонение от законов геометрической оптики).

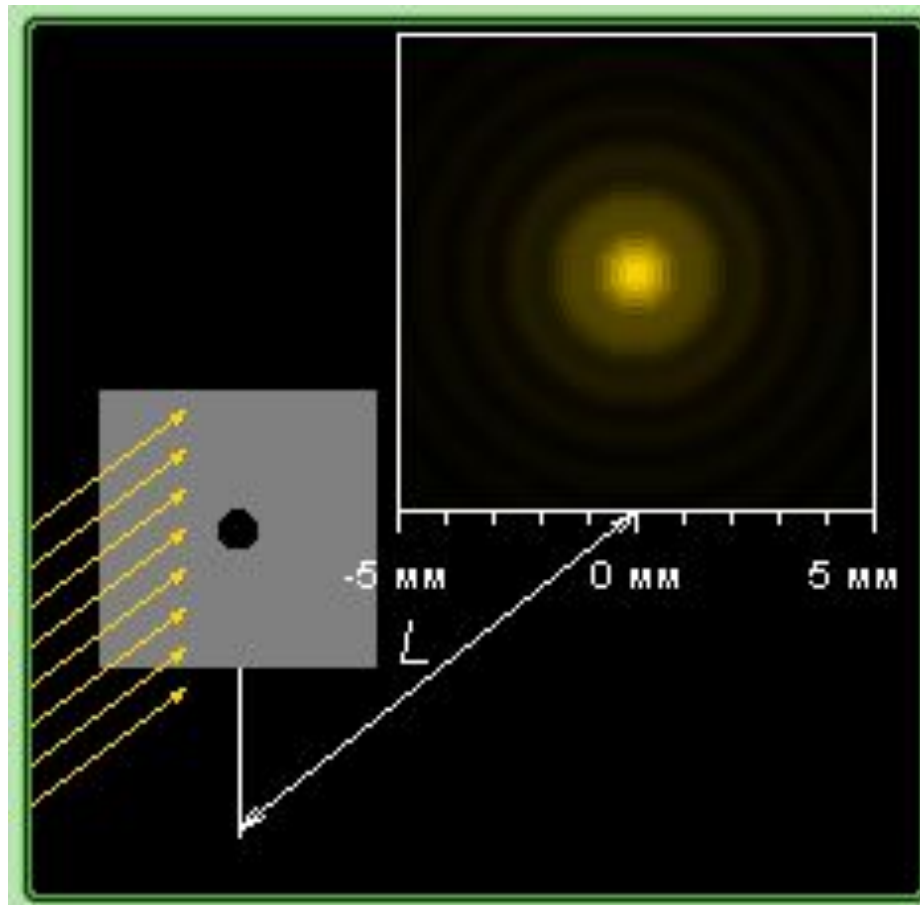
Необходимое условие наблюдения дифракции: размеры препятствий должны быть соизмеримы с длиной волны.

# Дифракция электромагнитных волн

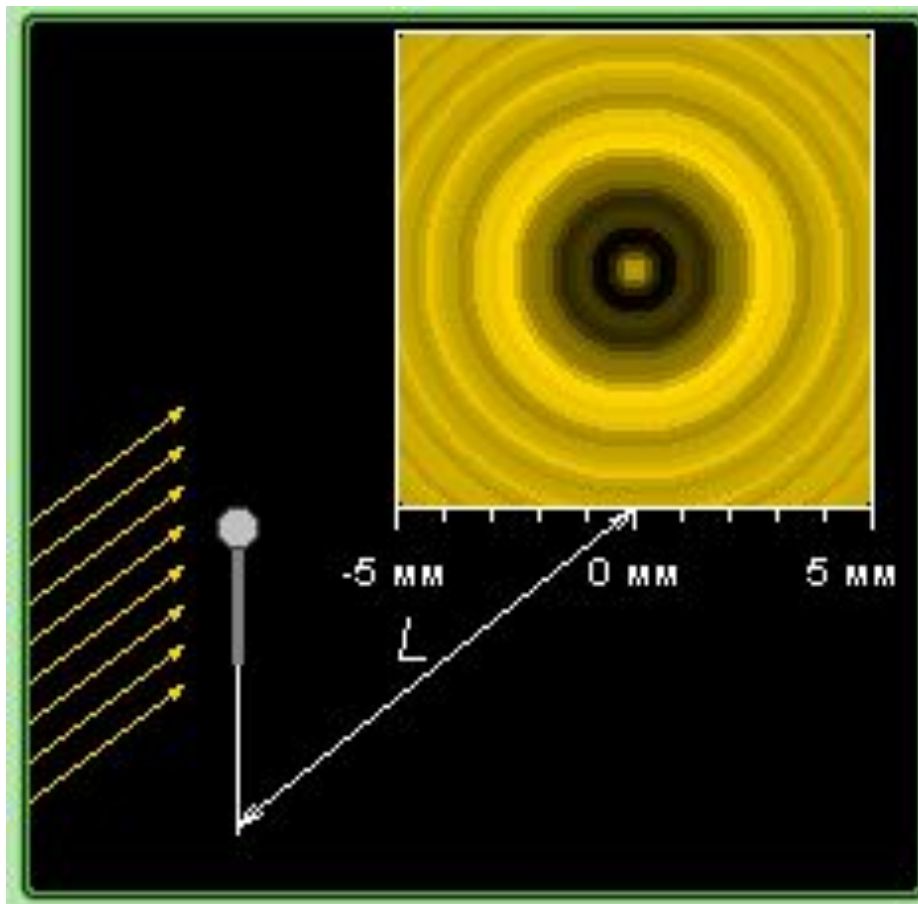
# Дифракция электромагнитных волн



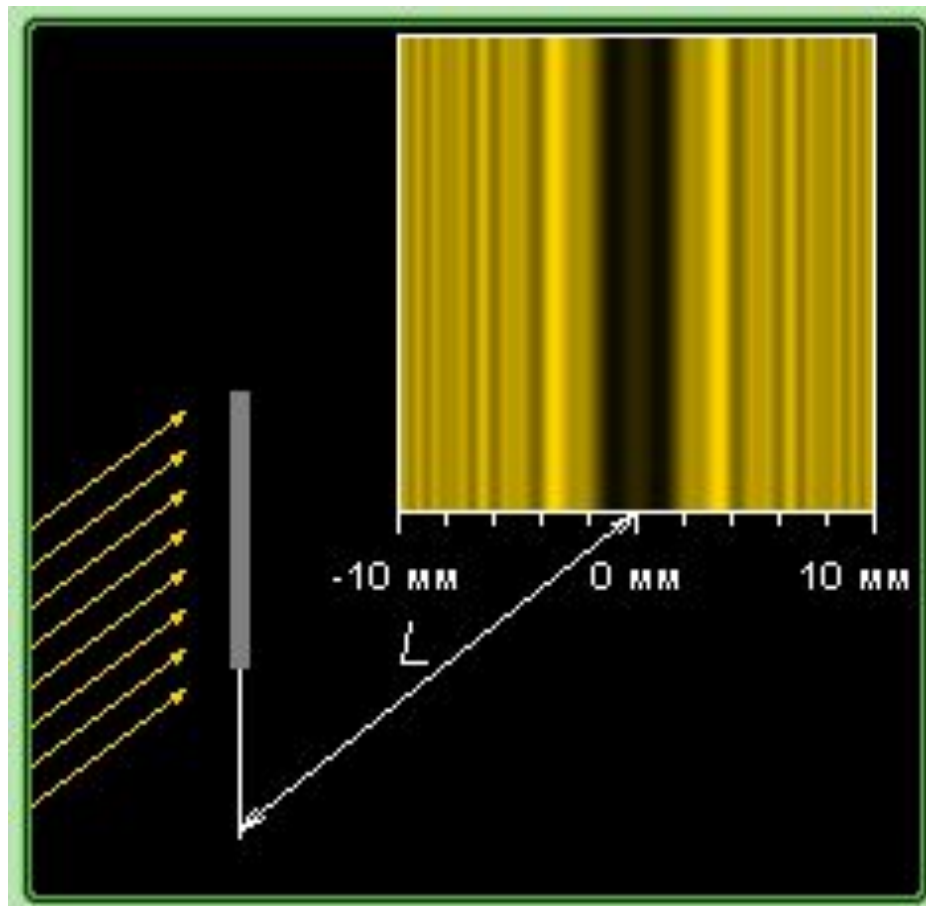
# Дифракция на круглом отверстии



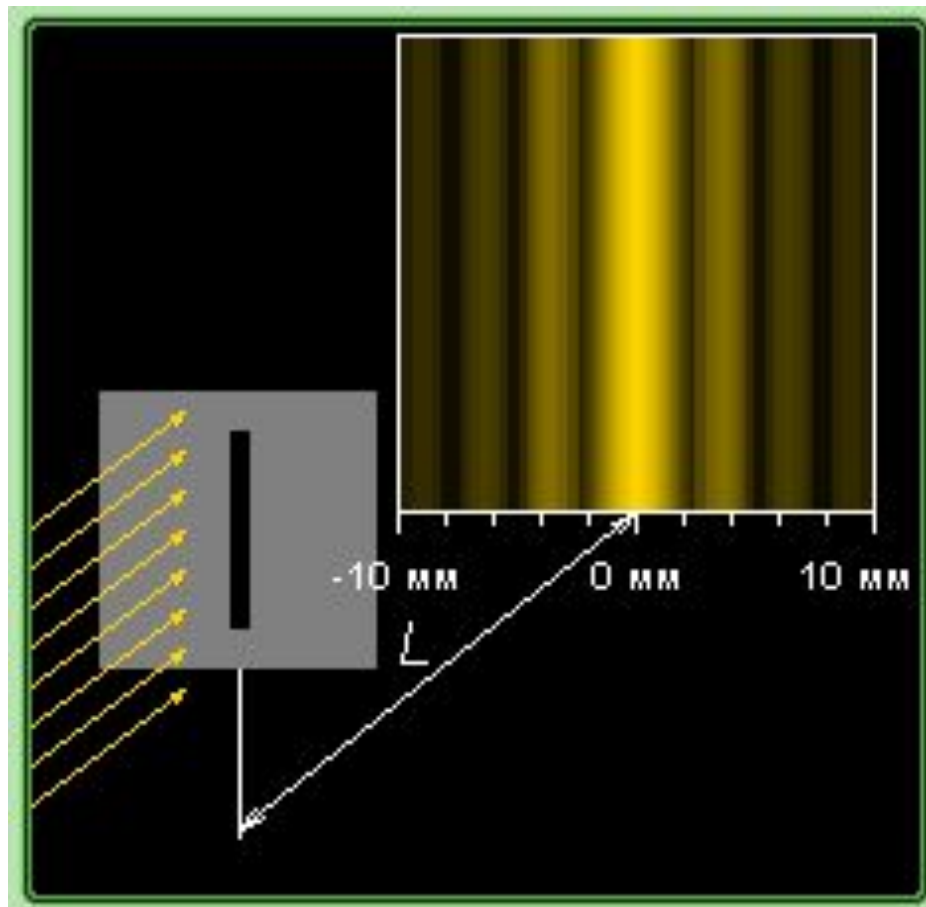
# Дифракция на шарике



# Дифракция на игле



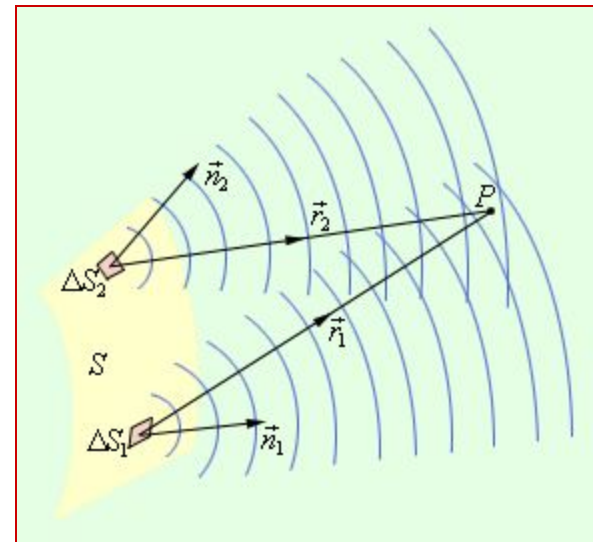
# Дифракция на щели





Решение задач по расчету дифракционной картины основывается на **принципе Гюйгенса-Френеля**:

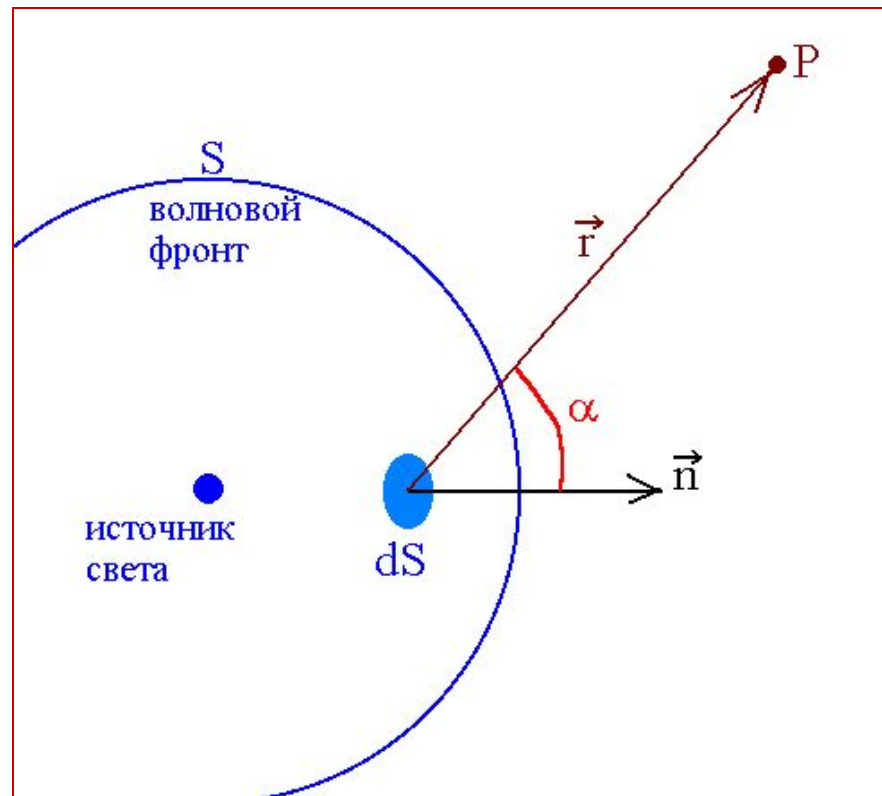
Каждая частица среды, до которой дошла световая волна, сама становится источником вторичных когерентных волн, результат интерференции которых определяет положение фронта волны в каждый следующий момент времени.



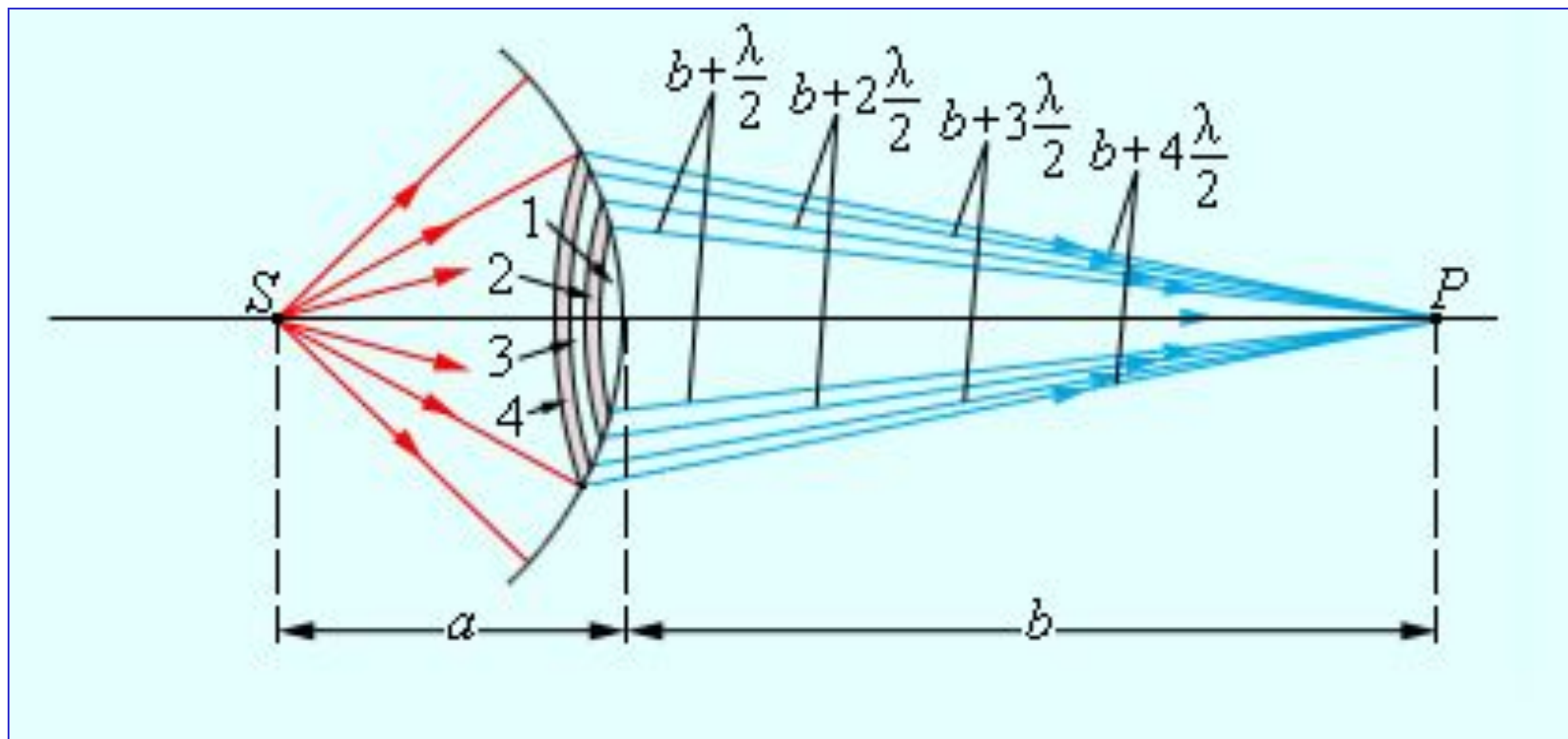
В соответствии с этим принципом, амплитуда светового вектора  $dE$  вторичных волн, приходящих в произвольную точку  $P$  от элемента  $dS$  волнового фронта  $S$  зависит от амплитуды  $E$  вторичных волн в том месте, где находится элемент  $dS$ , от площади этого элемента, от расстояния  $r$  между  $dS$  и точкой  $P$ , от угла  $\alpha$  между радиус-вектором и нормалью  $\vec{n}$  к фронту волны.

$$dE = f(\alpha) \cdot \frac{E}{r} \cdot dS$$

$$E = \int_S f(\alpha) \cdot \frac{E_0}{r} \cdot \cos(\omega t - kr + \varphi_0) \cdot dS$$

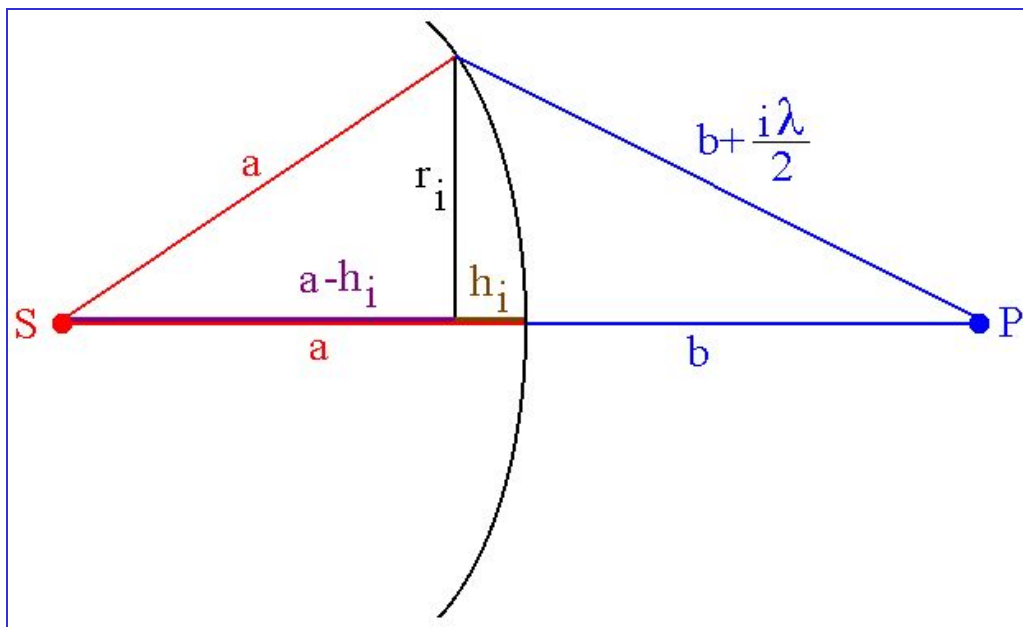


## Метод зон Френеля



$$E = E_1 - E_2 + E_3 - E_4 + \dots \pm E_n$$

$$E_1 > E_2 > E_3 > E_4 \dots$$



$$S_i = 2\pi a h_i - 2\pi a h_{i-1}$$

$$r_i^2 = a^2 - (a - h_i)^2$$

$$r_i^2 = \left(b + \frac{i\lambda}{2}\right)^2 - (b + h_i)^2$$

$$a^2 - a^2 + 2ah_i - h_i^2 = b^2 + bi\lambda + \left(\frac{i\lambda}{2}\right)^2 - b^2 - 2bh_i - h_i^2$$

$$2ah_i = bi\lambda - 2bh_i \quad (\text{при малых } i)$$

$$2ah_i = bi\lambda - 2bh_i$$

$$2ah_i + 2bh_i = i\lambda b$$

$$h_i = \frac{i\lambda b}{2(a+b)} \quad \text{Аналогично: } h_{i-1} = \frac{(i-1)\lambda b}{2(a+b)}$$

$$S_i = 2\pi ah_i - 2\pi ah_{i-1} = 2\pi a \frac{\lambda b}{2(a+b)} (i - i + 1)$$

$$S_i = \frac{\pi ab\lambda}{(a+b)}$$

При малых значениях  $i$ :  $h_i \ll a$ . Тогда:

$$r_i^2 = a^2 - (a - h_i)^2 \approx 2ah_i$$

С учетом  $h_i = \frac{i\lambda b}{2(a+b)}$  получим:

$$r_i^2 = \frac{2a \cdot i\lambda b}{2(a+b)} = \frac{a \cdot i\lambda b}{(a+b)}$$

$$r_i = \sqrt{\frac{ab}{a+b}} \cdot i\lambda$$

Для плоской волны:  $r_i = \sqrt{i\lambda b}$

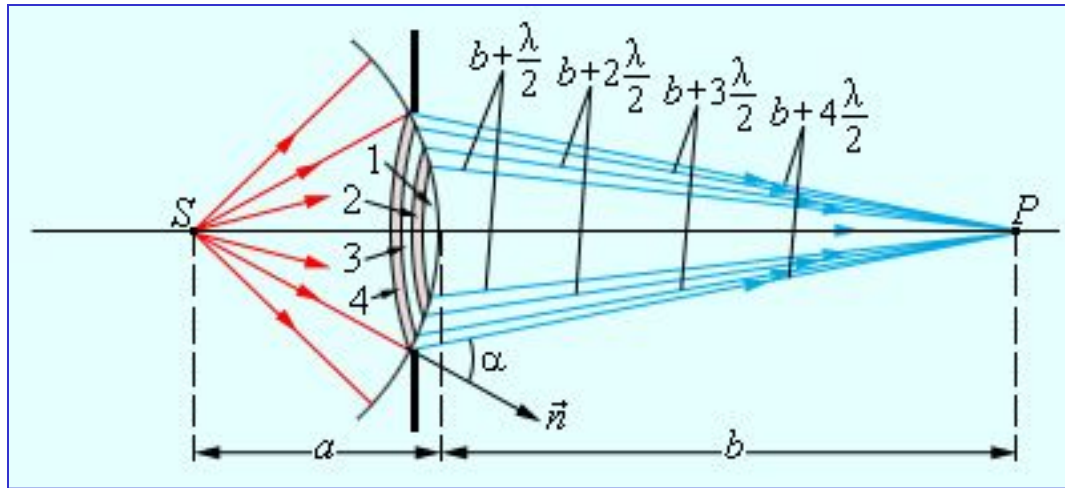
$$E = \frac{E_1}{2} + \left( \frac{E_1}{2} - E_2 + \frac{E_3}{2} \right) + \left( \frac{E_3}{2} - E_4 + \frac{E_5}{2} \right) + \dots \pm \frac{E_n}{2}$$

«+» : n - нечетное

«-» : n - четное

При больших значениях n:  $E \approx \frac{E_1}{2}$

## Дифракция Френеля на круглом отверстии:



1. Отверстие открывает небольшое нечетное число зон Френеля:

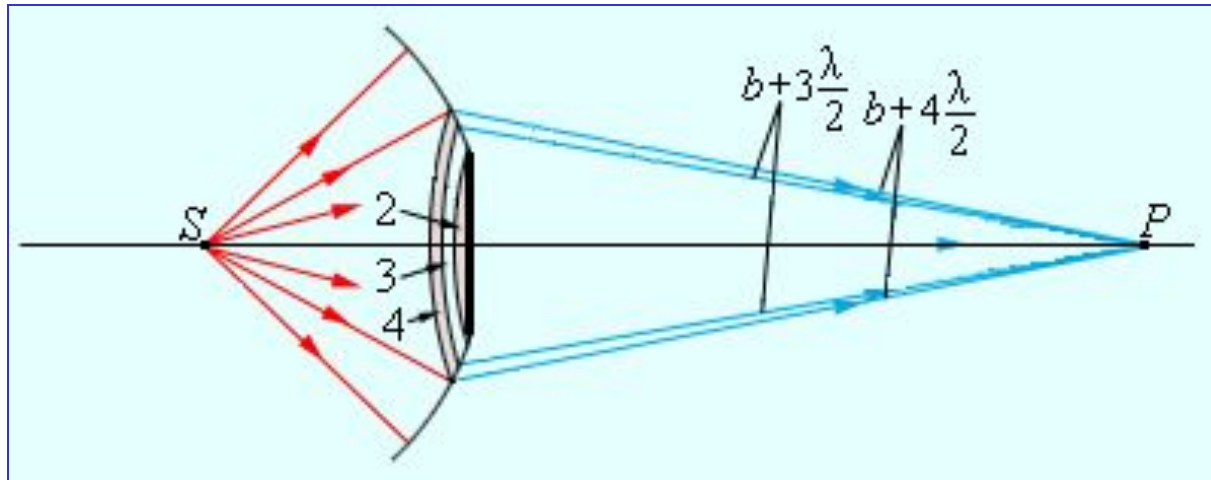
$$E = \frac{E_1}{2} + \frac{E_i}{2} \approx E_1$$

2. Отверстие открывает небольшое четное число зон Френеля:

$$E = \frac{E_1}{2} - \frac{E_i}{2} \approx 0$$



## Дифракция Френеля на непрозрачном диске:



1. Отверстие закрывает небольшое число  $i$  зон Френеля:

$$E = \frac{E_{i+1}}{2} + \left( \frac{E_{i+1}}{2} - E_{i+2} + \frac{E_{i+3}}{2} \right) + \dots \approx \frac{E_{i+1}}{2}$$

2. Отверстие закрывает большое число  $i$  зон Френеля:

$$E = \frac{E_{i+1}}{2} \approx 0$$

Условие максимума для щели

$$a \sin \varphi = (2m + 1) \frac{\lambda}{2}$$

Условие минимума для щели

$$a \sin \varphi = m\lambda$$

Условие максимума для дифракционной решетки

$$d \sin \varphi = m\lambda$$

$$d = \frac{N}{l}$$

Условие минимума для дифракционной решетки

$$a \sin \varphi = m\lambda$$

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN$$

$$D = \frac{d\varphi}{d\lambda} = \frac{m}{d \cos \varphi}$$

$$m_{\max} = \frac{d}{\lambda} \qquad N = \frac{2d}{\lambda} + 1$$

При этом интенсивность главных максимумов  $I_{\max}$  пропорциональна интенсивности  $I_{\varphi}$ , создаваемой в направлении  $\varphi$  одной щелью:

$$I_{\max} = N^2 I,$$

где  $N$  – общее число щелей решетки.

Дифракционная решетка является спектральным прибором, разрешающая способность которого определяется по формуле

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda},$$